

DADES GENERALS

Curs acadèmic	Curs 2024/2025
Tipus de curs	Màster de Formació ³ Permanent
Nombre de crèdits	60,00 Crèdits ECTS
Matrícula	0 euros (importe preu públic pendent d'aprovació ³ pel Consell Social Universitat de València.)
Requisits d'accés	<p>Els perfils d'ingrés recomanat es correspondran als perfils formatius dels següents plans d'estudi a nivell de grau: Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria en Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Enginyeria Electrònica Industrial, Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Informàtica Industrial i Robòtica, Enginyeria Informàtica, o graus, nacionals o estrangers, amb una alta afinitat als ací enumerats.</p> <p>També podrien considerar graduats en: Enginyeria de l'Energia, Enginyeria Aeroespacial, Enginyeria Telemàtica, Enginyeria Robòtica, Enginyeria Física, o títols afins.</p> <p>En menor mesura, es podrien considerar perfils científics tradicionals com a Grau en Física, Grau en Matemàtiques o Grau en Ciència de Dades.</p> <p>Es permetrà l'accés a l'estudiantat que li falte menys d'un 10% dels crèdits per a acabar els estudis de grau, de forma condicionada al fet que s'aproven durant el mateix curs acadèmic.</p> <p>Respecte al perfil personal de l'estudiant que millor s'adapta, correspon a persones que vulguen aprofundir amb rigor en els coneixements i les habilitats que es requereixen per a especialitzar-se en les àrees descrites per a l'orientació professional. Així haurien de tindre una afinitat amb la microelectrònica com a motor en amplis sectors socioeconòmics, i especialment, com a contribució essencial en sectors estratègics industrials.</p>
Modalitat	Presencial
Lloc d'impartició³	ETSE
Horari	Vesprades i dissabte
Direcció³	
Organitzador	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV)
Direcció³	Abilio Candido Reig Escrivà Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València María Teresa Bacete Castell ³ Site Director. Maxlinear
Terminis	
Preinscripció³ al curs	Fins a 12/07/2024
Data inici	Setembre 2024
Data fi	Juny 2025
Més informació³	
Telèfon	961 603 000
E-mail	informacio@adeituv.es

PROGRAMA

TEORIA (36 horas)

Tema 1. Fundamentos de Electrónica y Física de Semiconductores (6 horas).

- 1.1. Teoría de bandas y estructura cristalina.
- 1.2. Materiales semiconductores: propiedades ópticas y eléctricas.
- 1.3. La unión PN.

Tema 2. Dispositivos electrónicos (12 horas).

- 2.1. Diodos.
- 2.2. Transistor BJT.
- 2.3. Transistor MOS.

Tema 3. Dispositivos fotónicos (6 horas).

- 4.1. Fotodetectores.
- 4.2. Diodo LED y Láser.
- 4.3. Dispositivos ópticos integrados.

Tema 4. Tecnología microelectrónica (12 horas).

- 4.1. Crecimiento cristalino y depósito de capas delgadas.
 - 4.2. Recubrimiento de obleas: oxidación, implantación iónica y difusión.
 - 4.3. Litografía óptica.
 - 4.4. Definición de patrones por ataque químico y plasma.
- LABORATORIO (24 horas)
1. Simulación y caracterización del diodo (3 horas).
 2. Simulación y caracterización transistor BJT (3 horas).
 3. Simulación y caracterización del transistor MOSFET (3 horas).
 4. Implementación de un amplificador/conmutador (3 horas).
 5. Caracterización dispositivos optoelectrónicos (6 horas).
 6. Práctica/demo 1 sala gris (3 horas).
 7. Práctica/demo 2 sala gris (3 horas).

TEORIA (30h)

1. Introducción al diseño microelectrónico analógico
2. Diseño CMOS
3. Amplificadores CMOS monoetapa
4. Amplificadores CMOS diferenciales
5. Bloques básicos de diseño y circuitos de acondicionamiento
6. Amplificador operacional

LABORATORIO (30h)

1. Introducción. Caracterización de transistores MOS.
2. Fuentes y espejos de corriente
3. Amplificadores monoetapa
4. Amplificadores diferenciales
5. Amplificador diferencial. Análisis preliminar.
6. Análisis paramétricos
7. Optimización y casos límite ("corners")
8. "Layout". Posicionado e interconexión.
9. Verificación del layout. DRC. LVS.
10. Extracción de parámetros. QRC. Xstream.

Los contenidos de la teoría se han distribuido en 8 temas y un total de 3 ECTS.

TEORIA (30h)

Tema 1: El transistor MOS en conmutación.

En este tema se estudian las características eléctricas básicas del transistor trabajando en conmutación. Se estudia la puerta básica inversora y Schmitt-Trigger.

Tema 2: Puertas básicas CMOS y bloques combinacionales.

Puertas NAND, NOR, XOR. Niveles de ruido. Decodificadores, codificadores, multiplexores, comparadores.

Tema 3: Circuitos secuenciales CMOS.

Latch y flip-flop. Registros de desplazamiento, contadores y otros bloques combinacionales. Máquinas de estados.

Tema 4: Temporización.

Estudio de los tiempos que intervienen en el camino de datos y en el reloj.

Tema 5: Planificación de la alimentación.

Dominios de alimentación. Circuitos mixtos analógicos y digitales.

Tema 6: Planificación del Layout.

Áreas en el layout. Diseño de I/O.

Tema 7: Introducción a la síntesis lógica.

Descripción del diseño, esquemas y lenguajes, VHDL y Verilog.

Tema 8: Simulación y bancos de pruebas.

Preparación del circuito para simulación. Diseño y especificación de los bancos de pruebas.

LABORATORIO (30h)

El laboratorio supone un total de 3 ECTS distribuidos en 10 prácticas de 0,3 ECTS cada una.

Práctica 1: Puerta inversora CMOS, análisis estático y dinámico.

En esta sesión se introduce el uso de las herramientas de CAD para el diseño de circuitos digitales CMOS. Se diseña una puerta inversora CMOS y se estudian sus características mediante la simulación eléctrica Spice. Se estudian las características estáticas y dinámicas.

Práctica 2: Bloques combinacionales, análisis del camino de datos.

En esta sesión se diseñan algunas puertas con las que se crean circuitos básicos para estudiar los efectos en las características dinámicas de las cargas, así como los retrasos introducidos por el número de etapas y la carga.

Práctica 3: Bloques secuenciales, simulación de la frecuencia máxima.

En esta sesión se diseña un circuito secuencial simple y se estudia la frecuencia máxima de funcionamiento según diferentes circunstancias.

Práctica 4: Introducción al layout full-custom.

En esta sesión se estudia el funcionamiento de la herramienta de layout mediante la creación de un circuito combinacional básico. Se introducen los chequeos DRC y LVS.

Práctica 5: Diseño mixto analógico/digital.

En esta sesión se diseña y analiza un circuito mixto analógico/digital, prestando especial atención a los dominios de alimentación.

Práctica 6: Extracción de propiedades y simulación post-layout.

En esta sesión se implementa un circuito digital, se extraen sus propiedades a partir del layout y se simula, comparando los resultados pre y post layout.

Práctica 7: Anillo I/O.

En esta sesión se diseña el anillo de entrada/salida del chip con parte analógica y digital y separación de los dominios de alimentación.

Práctica 8: Análisis de los elementos básicos de una biblioteca digital.

En esta sesión se analiza un circuito digital construido a partir de elementos de una biblioteca digital.

Práctica 9: Simulación digital

En esta sesión se crea un circuito a partir de los elementos digitales de una biblioteca y se simula con un simulador digital.

Práctica 10: Introducción a la síntesis lógica.

En esta sesión se diseña un circuito sencillo utilizando un lenguaje de descripción hardware, se sintetiza generando el layout, se comprueba que coinciden layout y descripción y se simula.

Bloque I Test (15h)

Teoría (6 h)

Introducción

Tipos de errores

Tipos de tests

Hardware

Instrumentación

Análisis de resultados

Prácticas (9h)

1. Latch up en transistores / Caracterización térmica
2. Automatización de medidas
3. Análisis de datos (R/Matlab)

Bloque II Verificación digital (45h)

Introducción a Verificación Digital (6 h)

Verificación Digital (DV): contexto dentro del flujo de diseño de un chip.

Objetivos. Métodos de verificación. Coverage.

Metodología de trabajo: vPlan, regresiones, bug reporting y bug tracking. Tests dirigidos, tests randomizados, inyección de errores, stress.

Breve introducción a otras disciplinas en DV: verificación formal, emulación, DMS y AMS.

Testeando el test.

SystemVerilog para DV (9 h)

Verilog y SystemVerilog.

Interfaces. Conectando DUT y testbench. Glue logic.

Tipos de datos. Clases y relación entre las clases, patrones de software.

Tareas y funciones.

Randomización y constraints. Estrategias de generación de estímulos.

Hilos y comunicación entre procesos. Eventos, semáforos, mailboxes.

Assertions.

Definición de covergroups y coverpoints. Cross coverage. Sampling.

Breve introducción a DPI.

Ejemplos basados en casos reales.

Introducción a UVM (15 h)

Conceptos básicos de UVM (Universal Verification Methodology). Qué es una librería, un framework y por qué usarlo.

Modularización y reusabilidad.

Tipos de componentes: monitor, driver, agente, environment, scoreboard, testcase.

Arquitectura del testbench. Interacciones entre los componentes: llamadas y agregación. Transacciones, secuencias y uso de puertos.

Representación de registros. RAL.

Prácticas (15 h)

Práctica 1: vPlan.

Verificación de un DUT con SystemVerilog y clases.

Familiarización con las principales herramientas: compilador, simulador, visor de gráficas.

Práctica 2 (*2 sesiones): verificación de un DUT con UVM.

Generación de un testbench con todos los componentes.

Generación de testcases dirigidos.

Práctica 3: randomización y assertions con UVM.

Generación de testcases randomizados. Constraints.Regresiones.

Práctica 4: Coverage.

Creación de covergroups y sampleo.

Análisis de métricas.

Familiarización con las herramientas de recolección de coverage y análisis de métricas.

Consecución de 100% de funcional coverage y code coverage.

TEORIA (30h)

Tema 1: Introducción al diseño de sistemas embebidos.

Tema 2: Arquitectura de los sistemas embebidos.

Tema 3: Comunicación procesador con lógica programable.

- Tema 4: Creación periféricos usuario.
Tema 5: Entorno de desarrollo software.
Tema 6: Desarrollo y depuración software.
Tema 7: Revisión del diseño de sistemas embebidos en tiempo real.
Tema 8: Arquitectura avanzada de un sistema embebido.
Tema 9: Depuración del sistema embebido (HW/SW) utilizando Logic Analyzer.
Tema 10: Interfaces de memoria en un sistema embebido.
Tema 11: Manejo de interrupciones en sistemas en tiempo real.
Tema 12: Estudio de baja latencia y alto ancho de banda.
Tema 13: Configuración del procesador y creación de un Bootloader del sistema.
Tema 14: Estudio del profiling y de la optimización de rendimiento de un sistema embebido.

LABORATORIO (30h)

- Laboratorio 1: Diseño hardware de un sistema embebido básico.
Laboratorio 2: Añadiendo IPs en la lógica programable.
Laboratorio 3: Creando y añadiendo periféricos propios.
Laboratorio 4: Escribiendo aplicaciones software básicas.
Laboratorio 5: Depuración de software utilizando SDK.
Laboratorio 6: Creación de un sistema embebido completo.
Laboratorio 7: Depuración software/hardware usando Logic Analyzer.
Laboratorio 8: Extendiendo el espacio de memoria con BRAM.
Laboratorio 9: Acceso directo a memoria utilizando CDMA.
Laboratorio 10: Creación de un Bootloader del sistema embebido.
Laboratorio 11: Profiling y optimización de rendimiento en sistemas embebidos.

Los contenidos de la materia serán diferentes dependiendo de la práctica concreta que se deba llevar a cabo. A continuación se relacionan de modo genérico las posibles actividades que pueden realizarse durante las prácticas externas:

- Diseño microelectrónico analógico o mixto
- Diseño microelectrónico digital
- Test y verificación
- Sistemas embebidos. Software y hardware
- Diseño de layout
- Diseño de sistemas electrónicos
- Procesado digital de señal en sistemas VLSI
- ...

Los contenidos del Trabajo Fin de Master serán diferentes dependiendo de los objetivos concretos del proyecto a realizar. Pueden ser objeto de tema de Trabajo Fin de Master todos aquellos que sean propios de los estudios del Master. En particular, se podrán proyectar toda clase de sistemas y dispositivos microelectrónicos por cuantos procedimientos permita realizar la ingeniería actual. También podrá ser objeto del Trabajo Fin de Master los trabajos de investigación y desarrollo, y el modelado teórico o numérico de los dispositivos, circuitos o sistemas microelectrónicos. Se podrán considerar asimismo como temas de Trabajo Fin de Master los estudios relacionados con los contenidos de la Titulación y relativos a equipos, fábricas, instalaciones, servicios o su planificación, gestión o explotación. Por tanto los contenidos de la materia serán diferentes dependiendo del trabajo fin de máster concreto que se haya seleccionado por el alumno.

Aunque la lista de seminarios será dinámica, se proponen, en esta primera edición, los siguientes títulos:

- Fully Integrated Frequency Synthesizers: PLLs for Modern Wireless Communications Systems
- WiFi7 Physical layer transceiver design. An overview
- Clock Distribution for Modern RF ICs: an overview
- SW/HW codesign: FW architectures and development process during System On Chip design
- Digital verification: practical use case
- Business aspects in IC design
- Verification
- Medical applications
- Industrial applications
- Measurements

TEORIA (12h)

1. Revisión de estructuras básicas de circuitos
2. Técnicas de control aplicadas en diseño microelectrónico analógico
3. Ruido
4. Técnicas de layout
5. Ejemplos prácticos de proyectos: referencias de voltaje
6. Ejemplos prácticos de proyectos: reguladores de voltaje

LABORATORIO (18h)

1. Proyecto práctico I: Diseño y layout de una referencia de voltaje (parte 1/3)
2. Proyecto práctico I: Diseño y layout de una referencia de voltaje (parte 2/3)
3. Proyecto práctico I: Diseño y layout de una referencia de voltaje (parte 3/3)

4. Proyecto practico II: Dise±o y layout de un regulador de voltaje (parte 1/3)
5. Proyecto practico II: Dise±o y layout de un regulador de voltaje (parte 2/3)
6. Proyecto practico II: Dise±o y layout de un regulador de voltaje (parte 3/3)

TEORIA (20h)

1. Introduction a sistemas de comunicaci³n.
2. Componentes para desarrollo de bloques de radio frecuencia.
 - Extensi³n modelos RF
 - Mecanismos de degradaci³n y releability
 - L³neas de transmisi³n integradas
 - encapsulado
 - Bobinas integradas y extensi³n de RF de componentes pasivos
3. Dise±o amplificadores RF.
 - Introducci³n par³metros S
 - Criterios estabilidad
 - Topolog³as y amplificadores ganancia programable.
4. Amplificadores de bajo ruido
 - topolog³as
 - t³cnicas cancelaci³n ruido
5. Amplificadores de Potencia
 - topolog³as
 - mecanismos de degradaci³n, SOA y electro migraci³n
6. Mezcladores:
 - activos vs pasivos
 - t³cnicas mejora linealidad
7. Osciladores
 - osciladores de anillo.
 - osciladores LC.
 - Osciladores Colpits.
 - Osciladores controlados digitalmente.

LABORATORIO (10h)

- P1. Dise±o y simulaci³n l³neas de transmisi³n en inductancias
- P3. Selecci³n punto de polarizaci³n de un transistor y Layout
- P4. Dise±o Amplificador bajo ruido
- P5. Dise±o y simulaci³n de un Mezclador.
- P5. Dise±o y Simulaci³n de un VCO

TEORIA

- Tema 1: Circuitos de capacidades conmutadas (4h)
- Tema 2: T³cnicas de compensaci³n de offset, ruido de baja frecuencia y desapareamiento (4h)
- Tema 3: Convertidores de Nyquist (4h)
- Tema 4: Convertidores de sobremuestreo (4h)
- Tema 5: Sensores de temperatura integrados. (4h)
- Tema 6: Frontends para sensores capacitivos, resistivos o inductivos (4h)

LABORATORIO

- Pr³ctica 1: t³cnicas de simulaci³n de circuitos en tiempo discreto (1.5h)
- Pr³ctica 2: modelado de comportamiento de moduladores sigma-delta (1.5h)
- Pr³ctica 3: dise±o y simulaci³n de circuitos SC para convertidores Sigma-Delta (1.5h)
- Pr³ctica 4: dise±o y simulaci³n de un sensor de temperatura (1.5h)

TEORIA (15h)

- Dise±o Digital con System Verilog (8h)
- Codificaci³n de dise±os para s³ntesis. (2h)
- Codificaci³n de M³quinas de Estado Finitas. (1h)
- Generaci³n, procesado y distribuci³n de relojes y resets (1.5h)
- Sincronizaci³n de datos entre dominios de reloj y dominios de reset (1.5h)
- Dise±o de Bajo Consumo con UPF. Clock Gating, Power Gating, DVFS. (2h)
- Implementaci³n Digital VLSI (7h)
- Introducci³n al Flujo de Implementaci³n Digital (0.5h)
- Biblioteca de Celdas Digitales en Procesos de Fabricaci³n Avanzados (0.5)
- Definici³n de Restricciones Temporales (1h)
- S³ntesis (1h)
- Dise±o para Test (1h)
- Emplazamiento y Rutado (1h)
- An³lisis Temporal Est³tico (1h)
- An³lisis de Consumo (1h)

LABORATORIO (15h)

Proyecto practico 1: Dise±o RTL (Verilog) (7h)
Codificaci3n de dise±os para sAntesis
Codificaci3n de Mquinas de Estado Finitas
Generaci3n, procesado y distribuci3n de relojes y resets
Sincronizaci3n de datos entre dominios de reloj y dominios de reset
Proyecto practico 2: implementaci3n (6h)
SAntesis
Dise±o para Test
Emplazamiento y Rutado
Proyecto practico 3: anlisis (2h)
Anlisis Temporal Esttico
Anlisis de Consumo

TEORIA (18h)

Tema 1: Introducci3n a funciones principales de un sistema de comunicaciones
Tema 2: Adquisici3n de datos
Tema 3: Cuantificaci3n
Tema 4: Filtros, interpoladores/diezmadores
Tema 5: Modulaci3n/Demodulaci3n
Tema 6: Optimizaci3n de Velocidad, rea y Consumo

LABORATORIO (12h)

Laboratorio 1: Arquitectura de un filtro FIR
Laboratorio 2: Implementaci3n de un filtro FIR
Laboratorio 3: Simulaci3n de un filtro FIR

TEORA (18h)

Tema 1: Introducci3n (2h)
- Diferencias entre uC/Cpu/Core
- Principales fabricantes de CPU del mercado
- Profundizar en la introducci3n del ARM M4-Cortex como Core de Referencia para el curso
Tema 2: Cortex-M4 core (4h)
- Caractersticas del core
- Modelo de memoria
- Registros de proposito general
- Stacks
- Niveles de acceso y modos de programaci3n
- Excepciones
- Vector table
- Fault handling
- Instrumentation Trace Macrocell (ITM)
- AHB Access Port (AHB-AP)
- Bus Matrix
Tema 3: Perifericos del ARM M4-Cortex (4h)
- Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC)
- System Controll Block
- System timer
- Memory Protection Unit (MPU)
- Floating-point unit
Tema 4: Herramientas para programar un ARM M4-Cortex (3h)
- Proceso de compilacion
- Toolchain
- Makefile
- Startup file
- Linker script
Tema 5: Integraci3n de una CPU en diferentes microcontroladores (2h)
- ARM M4 por stm32f4 y texas
- ARM M0 por raspberry pico y stm32m0
- Otros ejemplos...
Tema 6: Interaccion del ARM M4-Cortex con los masters y esclavos del Stm32F4 (3h)
- Arquitectura del sistem de un Stm32F4
- Organizacion de la memoria
- Mapa de memoria

LABORATORIO (12h)

LAB1: Interacci3n con los registros de proposito general y de las configuraciones basicas
LAB2: Cambios de contexto para Irq y Excepciones Vs Interacci3n funciones caller/callee
LAB3: Creaci3n de un Scheduler
LAB4: Creaci3n Startup file + linker script
LAB5: Migrar todo lo realizado hasta ahora a la toolchain creando un makefile
LAB6: Analisis de consumo de memoria

Tema 1: Introducción a los sistemas embebidos (1h)

- Conceptos básicos de los sistemas embebidos. Características diferenciales
- Tipos de sistemas embebidos
- Aplicaciones de los sistemas embebidos
- Seguridad de los sistemas embebidos

Tema 2: Lenguajes de programación para sistemas embebidos (1h)

- Lenguajes de bajo nivel para sistemas embebidos. Ensamblador
- Lenguajes de alto nivel para sistemas embebidos. C y herramientas de compilación.
- Lenguajes de scripting útiles
- Interfaz entre diferentes lenguajes de programación

Tema 3: Arquitecturas SW/HW para sistemas embebidos (1h)

- CPUs
- Memorias
- Hosted/Hostless
- Flash/Flashless
- SDK y API de clientes
- VKs

Tema 4: Desarrollo de software para sistemas embebidos (1h)

- Ciclo de vida del desarrollo de software para sistemas embebidos
- Metodologías ágiles de desarrollo de software para sistemas embebidos
- Herramientas de desarrollo de software para sistemas embebidos

Tema 5: Descripción de características deseables del flujo de desarrollo (2h)

- Reducción del Time-to-market
- Definición de requisitos
- Funcionales
- Temporales
- Coste
- Etc.
- Arquitectura de Sistema
- Co-diseño HW/SW
- Plataformas de pruebas HW/SW
- Simulaciones
- Emuladores
- FPGAs
- Definición de interfaces HW/SW
- HW drivers
- Proceso de bringup
- Test Driven Development (TDD)
- Control de versiones (SCM)
- Gestión de tareas y errores en proyectos (Agile + Jira)
- Tests de Sistema
- Sistemas de Integración Continua
- Test benches
- Documentación

Tema 6: Diseño de software para sistemas embebidos (3h)

- SW product line: HW and SW configurations
- Arquitectura SW de capas, componentes e interfaces
- Diseño para el re-uso
- Capas de abstracción, HAL, OSAL.
- Código independiente de aplicación
- Código dependiente de aplicación
- Componentes de terceros y cuestiones legales
- Diseño para compatibilidad hacia atrás
- Diseño escalable
- Uso extensivo de técnicas de programación defensiva (assert)
- Chequeo de hard/soft deadlines
- Chequeo de problemas con la memoria (overwrites, stack overflows, etc)- Sistemas operativos de tiempo real (RTOS)
- Configuración
- Threads y prioridades
- Interrupciones
- Timers
- Stacks
- Primitivas de comunicación
- Aplicaciones multiprocesador
- Utilidades de debug y análisis del rendimiento
- Problemas recurrentes:
- Thread preemption
- Tiempo de respuesta a interrupciones
- Inversión de prioridades
- Tipos de Componentes
- HOST SW: drivers, apps, libs
- Firmware: dev, prod, BIST, loader
- Herramientas y scripts
- Interface públicos / privados

Tema 7: Funcionalidades usuales en sistemas embebidos (2h)

- Configuración específica del producto
- Producción
- Remota
- SW upgrades
- SDK para extender/cambiar funcionalidad
- Flash FS
- Interfaces
- JTAG
- UART
- SPI
- Consola de debug/operación
- Watchdog
- Herramientas de debug
- Memoria dinámica

Tema 8: Optimización de SW en Sistemas Embebidos (2h)

- Memoria vs Rendimiento
- Coste vs Facilidad en el desarrollo
- Requisitos HW
- Optimización de Memoria
- Compactación de estructuras de datos
- Datos en memorias compartidas
- Asignación de memoria (linker script)
- Reutilización de memoria
- Implementación de subsets de librerías (matemáticas, libC)
- Optimización de rendimiento
- Aritmética de punto fijo
- Uso de ensamblador.
- Re-escritura de código para uso de HW específico (DSP)
- DMA

Tema 9: Análisis de fallos en Sistemas Embebidos (2h)

- Requisitos HW
- JTAG
- Unit Tests
- Logs (serial, ethernet, files).
- Debug Buffers
- CPU Trace buffer
- Memory dumps
- Análisis de problemas en tiempo. Profiling
- Parseo y visualización de datos.
- Debug en sistemas multiprocesador

LABORATORIO:

La duración de cada laboratorio será de 1,5h:

Laboratorio 1: Diseño de la arquitectura de un sistema embebido

- Requisitos
 - Arquitectura y codificación HW/SW
 - Ventajas y desventajas de las distintas opciones en cuanto a coste, facilidad de desarrollo, rendimiento, etc.
- Laboratorio 2: Máquina virtualizada para desarrollo
- Virtualización de la plataforma de diseño (Docker)
 - Herramientas de desarrollo (GNU)
 - Sistema de control de versiones (GIT)
 - Unit tests (Google Test)
 - Análisis Estático de código (CppCheck)
 - Cobertura de testeo (Gcov)
 - Análisis dinámico de código (Valgrind/Electric Fence)

Laboratorio 3: Implementación de plataforma SW independiente de la aplicación sobre un simulador de RTOS

Laboratorio 4: Implementación de utilidades para debug (I)

Laboratorio 5: Implementación de utilidades para debug (I)

Laboratorio 6: Implementación de Mock para simular un HW específico

Laboratorio 7: Implementación de una aplicación real time ejemplo sobre la plataforma anterior (I)

Laboratorio 8: Implementación de una aplicación real time ejemplo sobre la plataforma anterior (II)

Laboratorio 9: Debug funcional de la aplicación

Laboratorio 10: Análisis de rendimiento y uso de memoria

TEORIA (15h)

Tema 0: Conceptos de validación y aseguramiento de la calidad (QA)

- Modelo en V
- Requisitos

- Pruebas
- Depuraci3n y defectos
- Conceptos de CI y de CD (Continuous Integration & Continuous Delivery)
- Tema 1: Defini3n de requisitos
 - Requisitos hardware
 - Requisitos software
 - Requisitos de sistema
 - Herramientas de gesti3n de requisitos
- Tema 2: Defini3n de prueba a partir de requisitos
 - Herramientas existentes vs propias
 - Tipos de pruebas (caja negra, caja blanca, funcionales, no funcionales...)
 - Defini3n de indicadores clave de rendimiento (KPI) a partir de requisitos
 - Defini3n de criterios de aceptaci3n '¿pass/fail'
- Tema 3: Introducci3n a la validaci3n de sistemas embebidos
 - Validaci3n de sistemas embebidos vs sistemas software:
 - Disponibilidad de recursos
 - Tiempos de ejecuci3n
 - Posibilidad de automatizaci3n
 - Defini3n de sistema bajo prueba
 - Interacci3n con el sistema bajo prueba
- Tema 4: Ejecuci3n y automatizaci3n de pruebas
 - Defini3n de bancos de prueba
 - Pruebas autom3ticas vs manuales: Por qu3 automatizar
 - Automatizaci3n:
 - Codificaci3n: Control de cambios
 - Instrumentaci3n
 - Ejecuci3n
 - Informes
 - Herramientas:
 - Lenguajes de programaci3n para pruebas autom3ticas
 - Herramientas para registrar progreso de pruebas
 - Frameworks de prueba
 - Recolecci3n organizada de datos para informe de defectos
- Tema 5: Defectos
 - Qu3 es un defecto y c3mo identificarlos
 - C3mo reportar un defecto correctamente
 - Herramientas de informe y trazabilidad de defectos
- Tema 6: CI para productos embebidos
 - Qu3 ofrece una herramienta de CI en la validaci3n de productos embebidos:
 - Defini3n de trabajos f3cilmente repetibles
 - Distribuci3n de los trabajos entre hardware disponible
 - Ventajas de tener un CI automatizado:
 - Optimizaci3n de tiempo maquina
 - Distribuci3n de recursos
 - Informes de resultados autom3ticos
 - Gesti3n de bancos de prueba:
 - Coexistencia entre automatizaci3n y uso manual de recursos
 - Interacci3n de los componentes de un entorno de CI- Herramientas habituales de CI:
 - Jenkins, Teamcity, Jira Workflow
- Tema 7: Obtenci3n y an3lisis de indicadores clave de rendimiento (KPI)
 - KPI relacionados con el producto:
 - Rendimiento
 - Estabilidad
 - Repetibilidad
 - KPI relacionados con el entorno de CI:
 - Cobertura de requisitos
 - Tiempo entre detecci3n de defecto y el arreglo
 - Uso de recursos

LABORATORIO (15h)

- Laboratorio 1: Definir requisitos a partir de una descripci3n breve de un producto.
- Laboratorio 2: Defini3n de pruebas a partir de requisitos. Plan de prueba.
- Laboratorio 3: Ejecuci3n manual de un plan de prueba. Pruebas exploratorias.
- Laboratorio 4: Automatizaci3n de las pruebas definidas.
- Laboratorio 5: Identificaci3n y reporte de defectos a partir de los resultados de las pruebas.
- Laboratorio 6: Creaci3n de un entorno CI completo.
- Laboratorio 7: Defini3n de KPI a partir de requisitos y resultados de las pruebas.

TEORIA (10h)

- Conceptos generales de arquitectura de computadores
- La arquitectura (ISA: Instruction Set Architecture)
- Diferencias entre CISC y RISC

- La CPU (Unidad Central de Proceso)
- Unidad de control
- ALU (Unidad Aritmética-Lógica)
- Buses
- Cache de instrucciones
- Pipelining
- Registros
- Cores
- Memoria (ROM, RAM)
- Memoria caché
- Periféricos de entrada/salida
- Interrupciones
- Microcontroladores
- Conceptos generales de software
- Lenguajes de programación
- Relación entre juego de instrucciones, código objeto y lenguaje ensamblador
- Tipos de archivo ejecutable
- Compiladores
- El linker o enlazador
- Linker scripts y scatter files
- Memoria estática y dinámica
- El stack y el heap
- El cargador de arranque o bootloader

Tiempo real y conceptos de RTOS

- RTOS vs GPOS
- Latency
- RTOS vs "bare-metal" ("super loop")
- Kernel / Scheduler
- preemptive time-slicing
- cooperative time-slicing
- Tick, Idle task, Tickless idle
- Interrupciones hardware y software
- Tareas e hilos
- thread stack
- prioridades
- o Paralelismo y concurrencia
- Sección Crítica
- Semáforos, mutex y operaciones atómicas
- Colas de mensajes o otros mecanismos
- Condition variables
- Problemas clásicos
- productor/consumidor
- condición de carrera
- inversión de prioridades
- Procesadores multi-core
- SMP (Symetric Multi-Processing)
- AMP (Asymmetric Multi-Processing)
- Comunicación entre tareas

Análisis de los RTOS más comúnmente usados

- FreeRTOS
- MicroC/OS-II (uCOS)
- ThreadX
- RTEMS
- Zephyr
- VxWorks

RTOS en FPGAs

- Procesadores softcore. Ejemplos
- Xilinx Microblaze
- Tensilica Xtensa
- Implementaciones RISC-V (Mi-V RV32, NEORV32, FEMTORV32)

LABORATORIO (20h)

Proyecto de un pequeño sistema controlado por RTOS:

Control de un ventilador accionado por motor DC (PWM) de forma automática mediante sensor de temperatura y controlable mediante comandos por Ethernet.

Los contenidos del "Proyecto Industrial en Microelectrónica" serán diferentes dependiendo de los objetivos concretos del proyecto a realizar. Pueden ser objeto de tema de aquellos que sean propios de los estudios del título. En particular, se podrán proyectar toda clase de sistemas y dispositivos microelectrónicos por cuantos procedimientos permita realizar la ingeniería actual. También podrá ser objeto del Proyecto Industrial en Microelectrónica los trabajos de investigación y desarrollo, y el

modelado teórico o numérico de los dispositivos, circuitos o sistemas microelectrónicos. Se podrán considerar asimismo los estudios relacionados con los contenidos del título relativos a equipos, fábricas, instalaciones, servicios o su planificación, gestión o explotación.

PROFESSORAT

Alejandro Acuña Muñoz

Ingeniero de Diseño Analógico. Maxlinear

Andrés Almarcha López

Senior Staff Digital IC Design Verification Technical Lead

María Teresa Bacete Castellá

Site Director. Maxlinear

José Antonio Boluda Grau

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Informàtica. Universitat de València

Javier Calpe Maravilla

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Miguel Chanca Martán

IC Lead. Robert Bosch

Fausto Codina Ferrás

Senior Manager Layout. Analog Devices

Enrique Company Bosch

Analog Design Manager. Analog Devices

Pablo Cruz Dato

Digital Architect. Bosch.

Francisco Escuder Roberto

Responsable de software. MaxLinear Hispania, S.L.

Luis Alfonso Espinosa Ortega

Ingeniero de Firmware. Analog Devices, S.L.U

José Manuel García González

Senior Principal design engineer. Ams-OSRAM

José Luis García Navas

Ingeniero de calidad de software. MaxLinear Hispania, S.L.

Raimundo García Olcina

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Marcos Hervás García

Ingeniero de Diseño Digital. MaxLinear Hispania, S.L.

Francisco Javier Jiménez Marquina

Director de Ingeniería. MaxLinear

Jose Rafael Lajara Vizcaino

Profesor/a Asociado de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Enrique Llorens Bufort

Ingeniero de Diseño Digital. MaxLinear Hispania, S.L.

José Marqués Hueso

Investigador/a distinguido/a Beatriz Galindo. Universitat de València

José Francisco Martá Martán

Software/Firmware Design Engineer. Ams-OSRAM

Fernando Pardo Carpio

Catedrático/a de Universidad. Departament d'Informàtica. Universitat de València

Joaquín Pérez Soler

Ayudante/a Doctor/a. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Sebastien Poirier

Principal engineer. Ams OSRAM

Ricardo Pureza Coimbra

Principal Analog Design Engineer. Analog Devices

Abilio Candido Reig Escriva

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Samuel Rodríguez Rodríguez

Ingeniero de Verificación

Antonio Jesús Rubio Salcedo

Ingeniero de Verificación de Diseño. Analog Devices, S.L.U

Rubén Salvador Edo

Diseñador Digital de Circuitos. Analog Devices, S.L.U

Rafael Serrano-Gotarredona

Director General. ams-OSRAM

Jesús Soret Medel

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Issac Suarez Alvarez

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Riccardo Tonietto

Analog IC Designer. Bosch

José Gabriel Torres Paás

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Ramón Tortosa Navas

Principal Engineer. Analog Devices, S.L.U

Lucas Valentin García

Algorithms and Machine Learning Engineer. Analog Devices, S.L.U

OBJECTIUS

Les sortides professionals que té el curs són:

Les eixides professionals previstes estan estretament vinculades als perfils més demandats en aquest àmbit, entre els quals es podrien destacar:

Dissenyadors de sistema (arquitectura del xip, partició Hw/Sw, algorítmica, DSP...); desenvolupadors de flux de disseny digital; dissenyadors de processadors i memòries embegudes; dissenyadors analògics; dissenyadors RF i MMIC; enginyers de disseny físic (P&R); dissenyadors de dispositius (layout); enginyers d'estàndards; enginyers de microprogramari; enginyers de programari; enginyers de test; enginyers de qualitat i fiabilitat; enginyers d'embalatge (chiplet...); dissenyadors de sensors i MEMS; tecnòlegs; dissenyadors de dispositius optoelectrònics; dissenyadors de PCBs; ...

En els últims temps, les empreses del sector de la microelectrònica i els semiconductors han vist com les seues ofertes de treball quedaven sovint vacants per falta de persones amb la formació demandada per a llocs tan específics. Per tant, l'objectiu fonamental d'aquest Màster és oferir a l'ecosistema VaSiC perfils professionals amb les competències necessàries per a ser directament incorporats en les seues plantilles.

METODOLOGIA

El centre responsable del Màster de Formació Permanent Multinacional en Microelectrònica és la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), i s'impartirà de manera presencial, en castellà, en horari de vesprades i dissabte. La matrícula serà gratuïta. Aquest Màster propi es desenvolupa en 60 ECTS, entre els quals s'inclouen 6 de pràctiques en empresa i 9 de TFM, tots ells a desenvolupar en projectes en empreses de VaSiC. La primera meitat del màster consistirà en cinc assignatures fonamentals, de 6 ECTS cadascuna, on es presentaran continguts de Dispositius electrònics i fòtons, Disseny CMOS analògic, Disseny CMOS digital, Test i verificació i Sistemes embeguts. Aquests continguts seran impartits principalment per professorat de la ETSE. En la segona part, juntament amb les PdE i el TFM, l'alumnat podrà triar entre tres itineraris: Disseny

microelectrónico avançat analògic i mixt, Disseny digital avançat i Sistemes-en-Xip (SoC). Per a això, es podran triar cinc assignatures optatives de 3 ECTS cadascuna entre nou possibles, i una de Seminaris. Aquestes assignatures seran impartides en la seua pràctica totalitat per professorat especialista de les empreses de VaSiC. Totes les assignatures, tant les fonamentals com les optatives, inclouran continguts teòrics i continguts pràctics. L'alumnat disposarà d'ordinadors adequats amb les eines utilitzades en l'estàndard industrial per al desenvolupament i anàlisi dels sistemes que es proposen: Cadence, Synopsys, desenvolupament ARM, Matlab... També disposaran de l'instrumental necessari per al test i caracterització dels dispositius que s'estudien. Es preveuen pràctiques en sala blanca.